

2E-5

パステスト向き有向グラフ簡約法と  
それに基づくテストケース選択法  
中野武司, 田中厚  
(日立製作所システム開発研究所)

1.はじめに

ソフトウェアテストに最も重要なテストケースの選択法は、プログラムの機能仕様からそれを選ぶ機能テスト法と、プログラム構造に基づいて選ぶ構造テスト法がある<sup>1)</sup>。最近、後者の代表的技法であるパステスト法を簡略化した分歧テスト法が注目され、その支援ツールも幾つか開発されている<sup>2)</sup>。これは、プログラム内の全分歧方向のテスト実行をめざすものであるが、従来の分歧網占有率測定法では、すべての分歧方向を計算に扱っておいたため、冗長なテストケースが選択され易いとか、テストの品質が過大に評価されるなどの欠点があつた。

そこで、我々は、パステストに本質的な分歧だけに着目する新しい網占有率を考案した。本方式で用いるパステスト向き有向グラフ簡約法については既に報告<sup>3)</sup>したが、ここでは、そのテストケース選択法への応用について述べる。

2. 従来方式の問題点

パステスト法は、被テストプログラムの制御構造を有向グラフで表現し、その入口から出口に至るすべての実行可能なパスのうちのできるだけ多くをテストしようとするものである。しかし、一般に実行可能なパスの数は膨大なので、実際には、10<sup>3</sup>スの代りに分歧点から分歧点までの部分パス (ddパス : decision-to-decision path) に注目した分歧テスト法が用いられる。以下に、パステストと分歧テストに用いる尺度を示す。

$$C_{path} = \frac{\text{実行済みパス数}}{\text{実行可能なパス数}}, \quad C_{dd} = \frac{\text{実行済みddパス数}}{\text{ddパス総数}}$$

次に  $C_{dd}$  の問題点について述べる。

(1) 冗長なテストケース選択:

今、ある被テストプログラムの制御フローロードを図1とする。a, b, c の 3 つの dd パスがある。そこで、まず c に注目して ac というパスを選ぶ。次にこのパスに含まれない b に注目して abc というパスを選ぶ。これで  $C_{dd} = 100\%$  になったが、実はそのためにはオエの 10<sup>3</sup>スだけ十分であり、オイの 10<sup>3</sup>スは冗長である。

(2) テスト品質の過大評価:

同じく、図2の例を参考ると、 $C_{dd}$  を 100% にするためには、 abd, abe, ac の 3 つのパスが必要である。これらを順に実行した時、 $C_{dd}$  の値は、 $60\% \rightarrow 80\% \rightarrow 100\%$  と変化する。ところが、本来のパステスト法では 1 回実行する毎に  $1/3$  ずつ線形に増加するこれが望ましい。 $(C_{path}: 33\% \rightarrow 67\% \rightarrow 100\%)$  このように  $C_{path}$  の代りに  $C_{dd}$  を用いると、途中の段階ではテストの品質が過大に評価される。

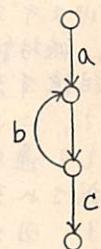


図1. 冗長なテストケース選択例

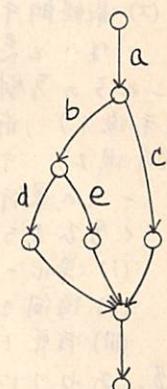


図2. 品質過大評価の例

### B. パステスト向き有向グラフ簡約法

前章で述べたような問題の生じた理由は、図1のa, c, 図2のa, bのようだ。パス選択に本質的でないddパスを他のddパスと併せて扱ったためである。そこで、我々は、これら2種類のddパスを識別するために、本質的なddパスに付属するアーチだけ残すような有向グラフ簡約法を考案した。

まず、有向グラフの2つのアーチ $\alpha$ ,  $\beta$ が相続子アーチに属するか次の概念を導入する。

[定義]  $\alpha$ を含む任意のパスが必ず $\beta$ を含む時、 $\beta$ を $\alpha$ の相続子アーチと呼ぶ。

[定義] 他のアーチの相続子になりえないアーチを原始アーチと呼ぶ。

次に、1-ドスから1-ドツへのアーチ $(x, y)$ が相続子となる条件を4種類示す。なお、IN(x), OUT(x)は1-ドスの入力、出力アーチ数、DOM(w), IDOM(w)はwの支配子、逆支配子の集合、Aはアーチ集合。

$$(R1) \text{ IN}(x) \neq 0 \wedge \text{OUT}(x) = 1$$

$$(R2) \text{ IN}(y) = 1 \wedge \text{OUT}(y) \neq 0$$

$$(R3) \text{ OUT}(x) \geq 2 \wedge x \in \text{IDOM}(w)$$

但し  $\forall w \in \{w \mid (x, w) \in A \wedge w \neq y\}$

$$(R4) \text{ IN}(y) \geq 2 \wedge y \in \text{DOM}(w)$$

但し  $\forall w \in \{w \mid (w, y) \in A \wedge w \neq x\}$

パステストの観点からは、相続子アーチは、被相続子アーチ(上記P)の網羅情報を相続するため、注目する必要はない。そこで、これから4つの条件を相続子消去規則として適用する。

そして通常手順で適用することにより、制御フロー-グラフを原始アーチだけで構成される簡約グラフに変換する。詳細はアルゴリズムは略す。

図1, 図2に適用して例を図3に示す。

### 4. テストケース選択への応用

分歧テストの観点からの冗長なテストケース選択防止のため、次の方針を採る。

(1) 被テストプログラムの制御フローグラフにおける、原始アーチへの注目。

(2) 最終的テストケース集合の中で、ある原始アーチを含みテストケース数が少ないと思われるよろを原始アーチに優先的に注目。

これらの方針に基づくテストケース選択法は次のようなものである。

(手順1) 前章の方法で、制御フローグラフを相続子簡約グラフに変換する。

(手順2) テストケースの選択は、本グラフを用いて、既に選択されたテストケースの実行パスに含まないアーチたち、以下に示すアーチをできるだけ多く含むように行う。その際、上位の項目を優先する。

(i) 単ループ(同一1-ドを結ぶアーチ)

(ii) 後向アーチ

(iii) 特定1-ド間に複数のアーチがあるもののうち、その数が多いもの。

### 5. おわりに

品質評価への応用効果についても検討済み。<sup>3)</sup>今後は実際の適用評価を行う。

#### 参考文献

1) 中野: ソフトウェアのテスト技術, 信学会誌 64, 5, 549-552 (1981).

2) 田中他: 構造化プログラム用テスト充分性評価ツールの開発, 第25回情報処理学会(557回期) 2E-1.

3) 中野: パステストに本質的な分歧に着目した網羅率尺度の提案, 情報論文誌, 23, 5 (未定).

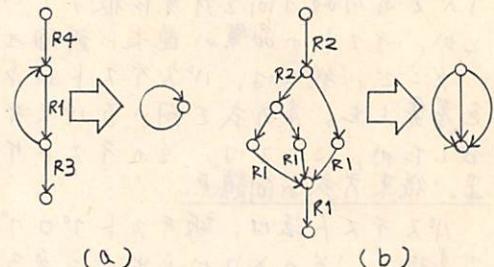


図3. 有向グラフ簡約法の適用例